

Beynəlxalq Konfrans "Fizika-2005" International Conference "Fizika-2005" Международная Конференция "Fizika-2005"

İyun - 9 June 2005 №40

Июнь стр.

Bakı, Azərbaycan

Baku, Azerbaijan

Баку, Азербайджан

səhifə

page

165-166

ВЛИЯНИЕ γ-ОБЛУЧЕНИЯ НА ТОК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ В CuGaSe₂

ГАСИМОГЛУ И., МАМЕДОВА И.А., БАГИРОВ А.Г.

Институт Физики НАН Азербайджана Баку AZ-1143, пр.Г.Джавида, 33

Исследовано влияние γ-облучения на ток короткого замыкания при 77К. После облучения появившаяся новая полоса с максимумом при 1,61 эВ в спектральной зависимости тока короткого замыкания связано с радиационными дефектами акцепторного типа.

 $A^IB^{III}C^{VI}, \\$ соединения Полупроводниковые представляют интерес для полупроводникового приборостроения. частности наличие двулучепреломления открывает перспективу использования нелинейных оптических преобразователях. Кроме того, сложный химический состав обуславливает богатый спектр локальных запрещенной зоне, обуславливает сложный механизм генерационнорекомбинационных процессов в этих соединениях. Определенный интерес представляют исследования дефектообразования под внешних факторов, в частности, у-облучения.

В настоящем сообщении приводятся результаты влияния γ -облучения на ток короткого замыкания в CuGaSe₂. В качестве источника γ -облучения использовался ${\rm Co}^{60}$ с энергией γ - квантов 1,25 MeV.

Монокристаллы CuGaSe $_2$ получены методом химических транспортных реакций. В качестве транспортера использовался кристаллический йод. Полученные монокристаллы имели р-тип проводимости. Удельное сопротивление было в пределе 10^2 к Ω при 300 К. Для измерения образцов наносились контакты из эвтектики In-Ga. Измерения проводились при температуре 77 К.

При измерениях дьюар с образцами вставлялся на оптическую скамью перед щелью свинцового контейнера. При измерениях тока короткого замыкания использовался электрометр B7-30, чувствительность которого 10^{-15} А. Интенсивность γ -

лучей была 20 P/c, время облучения 15 минут. В качестве источника монохроматического света использовался спектрометр SPM-2.

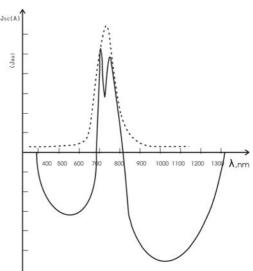


Рис. Спектральная зависимость тока короткого замыкания в p-CuGaSe₂ при 77К до облучения (пунктир), после облучения (сплошная)

На рисунке (a) представлена спектральная зависимость тока короткого замыкания исходного необлученного материала (CuGaSe₂) при 77 К.

Видно, что зависимость $J_{sc} \sim f(\lambda)$ имеет колокообразную форму с максимумом при λ =700 nm

(1,77eV). Максимум тока короткого замыкания по величине совпадает со значением ширины запрещенной зоны 1,68 эВ при 300К [1]. Поэтому следует предположить, что наблюдаемый ток короткого замыкания с максимумом при 1,77 эВ обусловлен электронными переходами из валентной зоны в зону проводимости.

На рисунке (b) представлена спектральная зависимость тока короткого замыкания после облучения при 77К. Видно, что после облучения в спектре наблюдается новая полоса при λ =770 nm (1,61 eV).

Расщепление между пиками составляет 0,13 eV. Появление второго пика возможно связано с образованием радиационных дефектов акцепторного типа, расположенных на расстоянии 0,13 эВ выше потолка валентной зоны. В [2] в спектре фотолюминесценции наблюдается пик при 1,59 эВ, который связывается с донорно-акцепторной рекомбинацией. Предполагается, что вакансии Se образуют донорные уровни, а вакансии Cu-акцепторные.

^{[1].} Masami Susaki, Takeshi Miyauchi, Hiromichi Horinaka and Nobuyuki Yamomoto /Japaneze Journal of Applied Physics V.17, 1978, pp 1555-1559

^{[2].} Migliaro P., Shay J.L., Kasper H.M. and Siguad Wagner: J. Appl. Phys. 46, 1975, 1777